

**O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI**

---

**Teri - Fizikaviy va mexanik sinovlar - Sirt qoplamasining qalinligini aniqlash**

**Rasmiy nashr**

**NATIONAL STANDARD OF UZBEKISTAN**

---

**Leather — Physical and mechanical tests — Determination of surface coating thickness**

**Official edition**

**Ushbu standartni O‘zbekiston Respublikasi hududida rasmiy chop etish mutloq  
huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli**

**O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI**

---

**Teri - Fizikaviy va mexanik sinovlar - Sirt qoplamasining qalinligini aniqlash**

**Rasmiy nashr**

**(ISO 17186:2011, IDT)**

**O'ZBEKISTON STANDARTLAR INSTITUTI**

**Toshkent**

## SO‘Z BOSHI

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan ISHLAB CHIQILDI VA TASDIQLASHGA TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2024 yil 15-iyuldagi 37/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI.

3. Ushbu standart ISO 17186:2011 “Leather — Physical and mechanical tests — Determination of surface coating thickness” standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI JORIY ETILISHI

*Ushbu standartni va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida joriy etish haqidagi axborot O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan nashr etiladigan ko‘rsatkichda chop etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan nashr etiladigan axborot ko‘rsatkichida chop etiladi.*

Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy chop etish mutloq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

## **Muqaddima**

ISO (Xalqaro standartlashtirish tashkiloti) - milliy standartlar organlarining (ISO a'zolari) butun dunyo federatsiyasi. Xalqaro standartlarni tayyorlash bo'yicha ishlar odatda ISO texnik qo'mitalari orqali amalga oshiriladi. Texnik qo'mita tashkil etilgan mavzudan manfaatdor bo'lgan har bir a'zo organ ushbu qo'mitada vakillik qilish huquqiga ega. Ishda ISO bilan hamkorlikda xalqaro tashkilotlar, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etmoqda. ISO xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) bilan elektrotexnika standartlashtirishning barcha masalalarida yaqindan hamkorlik qiladi.

Xalqaro standartlar ISO/IEC direktivalarining 2-qismida keltirilgan qoidalariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Texnik qo'mitalarning asosiy vazifasi xalqaro standartlarni tayyorlashdir. Texnik qo'mitalar tomonidan qabul qilingan Xalqaro standartlar loyihalari ovoz berish uchun a'zo organlarga yuboriladi. Xalqaro standart sifatida e'lon qilish ovoz beruvchi a'zo organlarning kamida 75% tomonidan ma'qullanishi kerak.

Ushbu hujjatning ayrim elementlari patent huquqlarining predmeti bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratiladi. ISO patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar emas.

ISO 17186 Xalqaro charm texnologlari va kimyogarlari ittifoqining fizik sinov komissiyasi (IUP komissiyasi, IULTCS) tomonidan Evropa standartlashtirish qo'mitasi (CEN) CEN/TC 289, kotibiyati joylashgan charm texnik qo'mitasi UNI bilan hamkorlikda tayyorlangan, ISO va CEN o'rtasidagi texnik hamkorlik to'g'risidagi bitimga (Vena kelishuvi) muvofiq amalga oshiriladi.

IULTCS dastlab 1897 yilda tashkil etilgan bo'lib, charm fan va texnologiyasini yanada rivojlantirish uchun professional charm jamiyatlarining butun dunyo bo'ylab tashkilotidir. IULTCSda teri namunalarini olish va sinovdan o'tkazish uchun xalqaro usullarni o'rnatish uchun mas'ul bo'lgan uchta komissiya mavjud. ISO IULTCSni terini sinash usullarini ishlab chiqish bo'yicha xalqaro standartlar organi sifatida tan oladi.

Ushbu ikkinchi nashr texnik jihatdan qayta ko'rib chiqilgan birinchi nashrni (ISO 17186:2002) bekor qiladi va almashtiradi, ayniqsa 6-bandda o'lchov va tahlilning muqobil usullari qo'shiladi.

**O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI**

**TERI - FIZIKAVIY VA MEXANIK SINOVLAR - SIRT QOPLAMASINING  
QALINLIGINI ANIQLASH**

**КОЖА — ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ТОЛЩИНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОКРЫТИЯ**

**LEATHER — PHYSICAL AND MECHANICAL TESTS — DETERMINATION OF  
SURFACE COATING THICKNESS**

**Amalga kiritish sanasi 15.09.2024 y.**

**1 Qo'llash doirasi**

Ushbu xalqaro standart nol siqilish ostida o'lchanganda teriga qo'llaniladigan sirt qoplamining qalinligini aniqlash usulini belgilaydi. Bu barcha turdagi teriga tegishli.

**2 Me'yoriy havolalar**

Quyidagi havola qilingan hujjatlar ushbu hujjatni qo'llash uchun ajralmas hisoblanadi. Sana ko'rsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr amal qiladi. Sana ko'rsatilmagan havolalar uchun havola qilingan hujjatning so'nggi nashri (shu jumladan har qanday testicular) qo'llaniladi.

ISO 2418 Teri - Kimyoviy, fizik-mexanik va chidamlilik sinovlari - Namuna olish joyi

ISO 2419 Teri - Fizikaviy va mexanik sinovlar - Namuna tayyorlash va tozalash

**3 Prinsip**

Terining bir qismi qoplangan yuzaga perpendikulyar ravishda olinadi. Sirt qoplamasining qalinligi mikroskop yordamida o'lchanadi va qalinligi va umumiy qalinligining foizi sifatida ifodalanadi.

**4 Jihozlar**

4.1 Yorug'lik mikroskopi yoki skanerlash elektron mikroskopi, ob'ekt maydoni o'lchami  $1\text{ mm} \times 1\text{ mm}$  yoki undan past bo'lgan va

- kompyuterga ulangan kamera tasvir bloki bilan jihozlangan (kamida  $500 \times 500$  pikseli ruxsat) yoki

- fotografik birlik bilan jihozlangan yoki

- gradusli shkalaga ega (kamida 100 shkala belgisi) okulyar bilan jihozlangan.

*Izoh 100 shkala belgilari  $1\text{ mm} \times 1\text{ mm}$  ob'ekt maydoni o'lchami uchun ob'ekt maydoni o'lchamidagi 10 mkm miqyosga mos keladi.*

50  $\mu\text{m}$  dan kam bo'lgan qoplama qalinligini o'lchash uchun ob'ekt maydoni o'lchami 0,4 mm  $\times$  0,4 mm yoki undan pastroq bo'lishi kerak. 15  $\mu\text{m}$  dan kichik qiymatlarni o'lchash uchun mos ob'ekt maydoni o'lchamiga ega skanerlash elektron mikroskopidan foydalanish kerak.

4.2 Ustara tig'i.

4.3 Eng kamida 10  $\mu\text{m}$  gacha o'lchanadigan va yorug'lik mikroskopida yoki skanerlovchi elektron mikroskopda foydalanish uchun mos keladigan panjara yoki shunga o'xshash kalibrlash moslamasi.

4.4 Agar skanerlovchi elektron mikroskop ishlatilsa, qoplash uchun mos element yoki qotishma (masalan, oltin)ni o'z ichiga olgan purkagich yoki bug'lanishdan foydalanadigan qoplama birligi.

4.5 Skanerli elektron mikroskop uchun mos bo'lgan namuna stublari.

**5 Namuna olish va namuna tayyorlash**

5.1 ISO 2418 ga muvofiq namuna. ISO 2419 ga muvofiq holat.

5.2 Taxminan 10 mm × 10 mm bo'lgan uchta sinov qismini kesib oling. Agar bitta partiyada ikkitadan ortiq teri yoki terini sinovdan o'tkazish talabi mavjud bo'lsa, umumiy yig'indisi kamida uch bo'lak bo'lishi sharti bilan har bir teridan faqat bitta sinov bo'lagi olinishi kerak. 5.3-bandda tavsiflanganidek, uchta sinov qismining har birini ajrating.

5.3 Jiletning kesuvchi chetini (4.2) go'sht tomoniga, pichoqni teri yuzasiga perpendikulyar qilib qo'ying va pichoqni terining butun qalinligi bo'ylab bosib, pichoq vertikal holatda qolishiga ishonch hosil qiling. Har bir bo'lim uchun yangi ustara pichog'ini ishlatish tavsiya etiladi.

Agar skanerlovchi elektron mikroskopdan foydalansangiz, yuqorida ta'riflanganidek tayyorlangan bo'lakni kesilgan yuzasi eng yuqoriga ko'tarib, namuna stendiga (4.5) yopishtiring. Etarli tasvir sifatini olish uchun stand va bo'lakni qoplama blokiga (4.4) qo'ying.

## 6 Jarayon

### 6.1 Umumiy tavsiflar

#### 6.1.1 O'lchov tamoyillari

Ushbu xalqaro standart sirt qoplamasining qalinligini o'lchash uchun ikkita asosiy tamoyilni tavsiflaydi.

A usuli teng masofadagi pozitsiyalarda bir qator qiymatlarni o'lchashga asoslangan (1-rasmga qarang). Bu standart og'ish va ishonch oralig'ini aniqlash imkonini beradi.

B usuli parallel chiziqlar yordamida o'lchashga asoslangan (2-rasmga qarang). Natijalarni statistik baholash mumkin emas, chunki operator to'ring gradusini cho'qqilar va chuqurliklar o'rtasida qo'lda joylashtirishi kerak. Bu jarayon allaqachon o'rtacha hisoblashni o'z ichiga oladi.

A usuliga ustunlik berish kerak.

A va B usullari yorug'lik mikroskoplari uchun, shuningdek, elektron mikroskoplarni skanerlash uchun ishlatilishi mumkin. Skanerlash elektron mikroskopining ish masofasi va tezlanish kuchlanishi namunani kalibrlash va o'lchash uchun bir xil bo'lishi kerak.



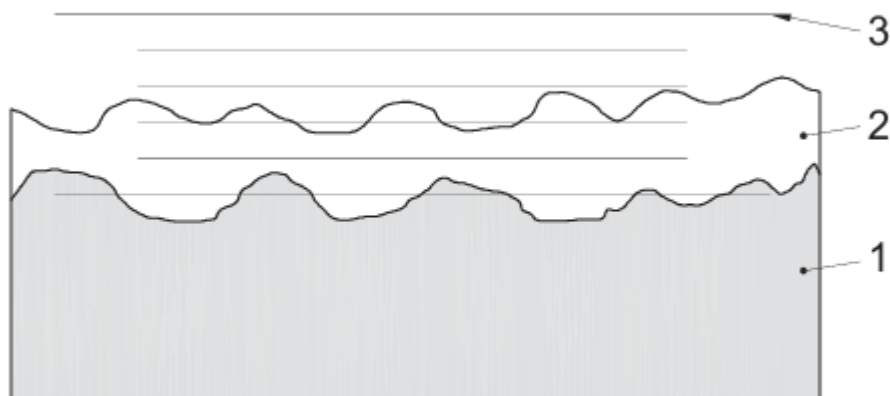
Kalit so'z

1 - teri

2 - qoplama

3 - teng masofadagi yagona o'lchov

**1-rasm — A usulining printsipi**



Kalit soʻz

1 - teri

2 - qoplama

3 - gradusli masshtab yoki parallel chiziqlar

### 2-rasm — B usulining printsipi

#### 6.1.2 Kattalashtirish va kalibrlash

Sirt qoplamasining odatdagi qalinligi (masalan, 10  $\mu\text{m}$  dan 200  $\mu\text{m}$  gacha) va terining umumiy qalinligi (masalan, 800  $\mu\text{m}$  dan 3 000  $\mu\text{m}$  gacha) oʻzgarishi sababli, odatda mikroskopning turli kattalashtirishlaridan foydalanish kerak boʻladi.

Har bir holat uchun qalinlikni ishonchli oʻlchash imkonini beruvchi mos kattalashtirishni tanlang.

Amaldagi har bir kattalashtirish uchun 6.2 va 6.3 dagi batafsil koʻrsatmalarga muvofiq oʻlchov tizimini kalibrlang.

6.2 A usuli - teng masofadagi pozitsiyalarda yagona qiymatlarni oʻlchashga asoslangan

6.2.1 Mikroskopning tahlil birligi sifatida mos kompyuter dasturining oʻlchov belgilaridan foydalangan holda oʻlchash

6.2.1.1 Toʻr (4.3) yordamida mikroskopning oʻlchash tizimini (4.1) kalibrlang. Amaldagi tizim uchun qoʻllanmadagi koʻrsatmalarga rioya qiling.

6.2.1.2 5.3 da tayyorlangan bir kesmani mikroskop ostiga qoʻying. Oʻlchovni kesmaning tasodifiy nuqtasida boshlang va bu nuqtani koʻrish maydonining oʻrtasiga sozlang. Oʻlchov tizimining dasturiy taʼminotiga koʻra, qoplama / teri chegarasida oʻlchovning boshlangʻich nuqtasini oʻrnating.

6.2.1.3 Keyin teri yuzasiga oʻlchash nuqtasini oʻrnating, bunda sozlashni amalga oshirish kerak, qoplama chegarasining harakatiga perpendikulyar (1-rasmga qarang). Belgilangan masofaga eʼtibor bering.

6.2.1.4 Mikroskop stolini bitta koʻrish maydonining maʼlum masofasiga yoki mahkamlangan ofsetga (yaʼni, 50  $\mu\text{m}$  dan 500  $\mu\text{m}$  gacha) siljitish orqali namunani sirtga parallel ravishda oʻtkazing, shunda maydonning oʻrtasida yangi oʻlchash nuqtasi joylashadi. koʻrish. Ikki oʻlchov orasidagi masofa qoplama qalinligidan kattaroq boʻlishi kerak. 6.2.1.3-bandda koʻrsatilganidek, ushbu nuqtada qoplama qalinligini oʻlchang.

6.2.1.5 Oʻlchovni kamida oltita oʻlchov oʻtkazilgunga qadar 6.2.1.2 - 6.2.1.4-bandlarda koʻrsatilgan tarzda davom ettiring.

6.2.1.6 Olingan barcha koʻrsatkichlarni 6.2.1.1 da tavsiflangan kalibrlashdan foydalanib, mikrometrga aylantiring

6.2.1.7 6.2.1.2 - 6.2.1.6-bandlarda koʻrsatilgan protsedura yordamida umumiy qalinlikni oʻlchang, oʻlchov nuqtasini terining goʻshti tomoniga toʻgʻrilang.

6.2.1.8 Qolgan ikkita boʻlim uchun 6.2.1.2-6.2.1.7-ni takrorlang.

6.2.1.9 Qalinligi va umumiy qalinligining barcha yagona qiymatlarining o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblang. Qoplamaning qalinligi 50 µm yoki undan yuqori bo'lgan qoplama uchun eng yaqin 5 µm gacha, qoplama qalinligi 50 µm dan kam bo'lsa, 2 µm gacha aniqlang. Umumiy qalinligini 10 µm aniqlikda ifodalang.

Agar kerak bo'lsa, standart og'ishni quyidagicha hisoblang:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (t_i - t)^2}{n - 1}}$$

Bu yerda

$s$  - standart og'ish;

$t_i$  - qoplama qalinligining yagona qiymati;

$t$  - qoplama qalinligining o'rtacha qiymati;

$n$  - bitta o'lchovlar soni.

6.2.2 gradusli shkala o'rnatilgan yorug'lik mikroskopi yordamida o'lchash

6.2.2.1 Grid (4.3) yordamida gradusli shkala (4.1) bilan mikroskopni kalibrlang.

6.2.2.2 5.3 da tayyorlangan bir kesmani mikroskop ostiga qo'ying. O'lchovni kesmaning tasodifiy nuqtasida boshlang va bu nuqtani ko'rish maydonining o'rtasiga sozlang. Bo'limni shunday joylashtiringki, o'zaro faoliyat sim yoki asosiy tugatishlardan biri to'liq kesmaning shu nuqtasida qoplama/teri chegarasiga to'g'ri keladi.

O'lchov nuqtasida qoplamaning tashqi yuzasiga mos keladigan shkalaning o'qishini oling.

6.2.2.3 Mikroskop stolini bitta ko'rish maydonida ma'lum masofaga yoki mahkamlangan ofsetga (ya'ni 50 µm dan 500 µm gacha) siljitish orqali namunani sirtga parallel ravishda olib boring, shunda maydonning o'rtasida yangi o'lchash nuqtasi joylashadi. ko'rish. Ikki o'lchov orasidagi masofa qoplama qalinligidan kattaroq bo'lishi kerak. Ushbu nuqtada 6.2.2.2-bandda tavsiflanganidek, qoplama qalinligini o'lchang.

6.2.2.4 Kamida oltita o'lchov o'tkazilgunga qadar 6.2.2.2 va 6.2.2.3-bandlarda ko'rsatilgan tarzda o'lchashni davom ettiring.

6.2.2.5 Olingan barcha ko'rsatkichlarni 6.2.2.1-bandda tavsiflangan kalibrlashdan foydalanib, mikrometrغا aylantiring.

6.2.2.6 6.2.2.2 - 6.2.2.5-bandlarda ko'rsatilgan protsedura yordamida umumiy qalinlikni o'lchang, gradusli shkalani terining go'shti tomoniga to'g'rilang.

6.2.2.7 Qolgan ikkita bo'lim uchun 6.2.2.2 - 6.2.2.6-ni takrorlang.

6. 2.2.8 Qoplamaning qalinligi va umumiy qalinligining barcha yagona qiymatlarining o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblang. Qoplamaning qalinligi 50 µm yoki undan yuqori bo'lgan qoplama uchun eng yaqin 5 µm gacha, qoplama qalinligi 50 µm dan kam bo'lsa, 2 µm gacha aniqlang. Umumiy qalinligini 10 µm aniqlikda ifodalang.

Agar kerak bo'lsa, standart og'ishni 6.2.1.9 da ko'rsatilganidek hisoblang.

6.3 B usuli - Parallel chiziqlar yordamida o'lchashga asoslangan

6.3.1 Mikroskopning tahlil birligi sifatida mos kompyuter dasturining o'lchov chiziqlari yordamida o'lchash

6.3.1.1 To'r (4.3) yordamida mikroskopning (4.1) o'lchash tizimini kalibrlash. Amaldagi tizim uchun qo'llanmadagi ko'rsatmalarga rioya qiling.

6.3.1.2 5.3 da tayyorlangan bir kesmani mikroskop ostiga qo'ying. Bo'limni kompyuter dasturining o'lchov chizig'i qoplama/teri chegarasiga to'g'ri keladigan tarzda joylashtiring. Agar qoplama / teri chegarasi to'liqlik bo'lsa, 2-rasmda ko'rsatilganidek, kompyuter dasturining o'lchov chizig'ini tepaliklar va chuqurliklar o'rtasida o'rtasiga qo'ying. Kompyuterga asoslangan dasturning funktsiyasidan so'ng, o'lchov chizig'ini qoplamaning tashqi yuzasiga bir xil tarzda tekislang va ko'rsatilgan masofaga e'tibor bering.

6.3.1.3 Kompyuter dasturining o'lchov chizig'i terining go'shti tomoniga to'g'ri keladigan tarzda bo'limni joylashtirish orqali bir xil nuqtada umumiy qalinlikni o'lchang. Keyin o'lchov chizig'ini qoplamaning tashqi yuzasiga tekislang va ko'rsatilgan masofaga e'tibor bering.



6.3.1.4 6.3.1.2 ga muvofiq olingan ko'rsatkichlarni 6.3.1.1-bandda tavsiflangan kalibrlash yordamida mikrometrغا aylantiring.

6.3.1.5 Qolgan ikkita bo'lim uchun 6.3.1.2-6.3.1.4-ni takrorlang.

6.3.1.6 Uchta qoplama qalinligi va uchta umumiy qalinligining o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblang. Qoplamaning qalinligi 50 µm yoki undan yuqori bo'lgan qoplama uchun eng yaqin 5 µm gacha, qoplama qalinligi 50 µm dan kam bo'lsa, 2 µm gacha aniqlang. Umumiy qalinligini 10 µm aniqlikda ifodalang.

6.3.2 gradusli shkala o'rnatilgan yorug'lik mikroskopi yordamida o'lchash

6.3.2.1 Grid (4.3) yordamida gradusli shkala (4.1) bilan mikroskopni kalibrlang.

6.3.2.2 5.3 da tayyorlangan bir kesmani mikroskop ostiga qo'ying. Bo'limni shunday joylashtiringki, o'zaro faoliyat sim yoki asosiy tugatishlardan biri qoplama/teri chegarasiga to'g'ri keladi. Agar qoplama / teri chegarasi to'liqlik bo'lsa, 2-rasmda ko'rsatilganidek, o'zaro faoliyat simni yoki asosiy tugatishni cho'qqilar va chuqurliklar o'rtasida o'rtasiga qo'ying.

Qoplamaning tashqi yuzasiga mos keladigan shkalani o'qishni oling.

6.3.2.3 Xuddi shu nuqtada umumiy qalinlikni o'lchab, kesmani shunday joylashtiringki, o'zaro faoliyat sim yoki asosiy graduslardan biri terining go'shti tomoniga to'g'ri keladi. Qoplamaning tashqi yuzasiga mos keladigan shkalani o'qishni oling.

6.3.2.4 6.3.2.2 va 6.3.2.3 ga muvofiq olingan ko'rsatkichlarni 6.3.2.1-bandda tavsiflangan kalibrlash yordamida mikrometrغا o'zgartiring.

6.3.2.5 Qolgan ikkita bo'lim uchun 6.3.2.2 - 6.3.2.4-ni takrorlang.

6.3.2.6 Uchta qoplama qalinligi va uchta umumiy qalinligining o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblang. Qoplamaning qalinligi 50 µm yoki undan yuqori bo'lgan qoplama uchun eng yaqin 5 µm gacha, qoplama qalinligi 50 µm dan kam bo'lsa, 2 µm gacha aniqlang. Umumiy qalinligini 10 µm aniqlikda ifodalang.

6.3.3 Fotosuratlarini olish vositasi o'rnatilgan mikroskop yordamida o'lchash

6.3.3.1 To'rni (4.3) mikroskop ostiga qo'ying, uni suratga oling va nashrni oling.

6.3.3.2 5.3 da tayyorlangan bir qismni mikroskop ostiga qo'ying, uni 6.3.3.1 da qo'llanilgan kattalashtirishda suratga oling va chop etishni oling.

6.3.3.3 Agar charm bo'lak va panjara bir xil kattalashtirishda suratga olingan bo'lsa (6.3.3.1 va 6.3.3.2), to'rning bosmasi ham qoplamani, ham terining umumiy qalinligini o'lchashning bevosita vositasi sifatida ishlatilishi mumkin. To'r shaffof folga ustiga bosib chiqarilishi kerak.

6.3.3.4 6.3.3.2-bandda olingan bosma bo'yicha qoplama/charm chegarasidagi katak nashrining asosiy bosqichlaridan birini joylashtirish. Agar qoplama/teri chegarasi to'liqlik bo'lsa, 2-rasmda ko'rsatilganidek, asosiy bitiruvni cho'qqilar va chuqurliklar o'rtasida o'rtasiga qo'ying. Qoplamaning tashqi yuzasiga mos keladigan shkalani o'qishni oling.

6.3.3.5 Chop etishning bir xil nuqtasida umumiy qalinlikni o'lchab, to'rning bosma qismidagi asosiy masshtabli graduatsiyani terining go'shti tomoni bilan tekislang va qoplamaning tashqi yuzasiga mos keladigan shkala ko'rsatkichini oling.

6.3.3.6 6.3.3.4 va 6.3.3.5 ga muvofiq olingan ko'rsatkichlarni 6.3.3.3-bandda tasvirlangan kalibrlashdan foydalanib, mikrometrغا aylantiring.

6.3.3.7 Qolgan ikkita bo'lim uchun 6.3.3.2 - 6.3.3.6-ni takrorlang.

6.3.3.8 Uchta qoplama qalinligi va uchta umumiy qalinligining o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblang. Qoplamaning qalinligi 50 µm yoki undan yuqori bo'lgan qoplama uchun eng yaqin 5 µm gacha, qoplama qalinligi 50 µm dan kam bo'lsa, 2 µm gacha aniqlang. Umumiy qalinligini 10 µm aniqlikda ifodalang.

## 7 Natijalarni ifodalash

Qoplamaning foizini quyidagi ibora yordamida hisoblash kerak:

$$\frac{t}{T} \times 100$$

Bu yerda

$t$  - qoplamaning o'rtacha qalinligi, mikrometrda;

$T$  - terining o'rtacha qalinligi, mikrometrda.

### **8 Sinov hisoboti**

Sinov hisobotida quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak:

a) ushbu xalqaro standartga havola, ya'ni ISO 17186:2011;

b) ishlatiladigan usul (A yoki B);

c) qoplamaning o'rtacha qalinligi;

d) terining o'rtacha qalinligi;

e) qoplamaning ulushi;

f) ISO 2419 da ko'rsatilganidek, konditsionerlik uchun ishlatiladigan standart atmosfera;

g) ushbu xalqaro standartda ko'rsatilgan usuldan har qanday og'ish;

h) namunani identifikatsiya qilish uchun to'liq ma'lumot va namuna olishga nisbatan ISO 2418 dan har qanday og'ish.

